

X8068

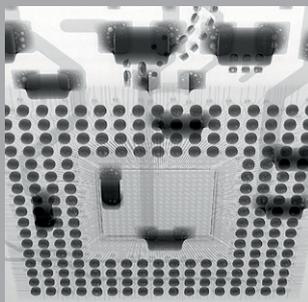
最高レベルの要求に対応する
フレキシブルなX線検査



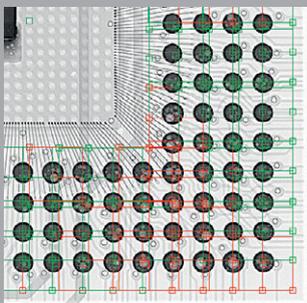
3D-MXI

Quality Uplinkを装備!

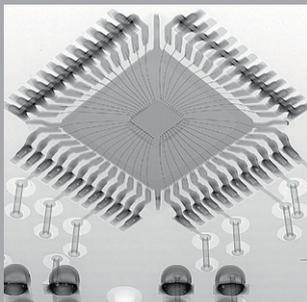
スピーディ、フレキシブル、高性能



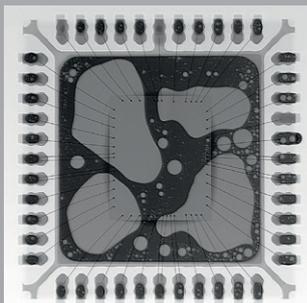
BGA全容の斜め方向透過



BGA欠陥分析



QFPの斜め方向透過



直交型透過のQFP

高解像度のX線検査 Made by Viscom

二種類の検査コンセプトを一つのシステムに統合:
Viscom XMCおよびViscom SI

高性能の開放型マイクロフォーカス透過X線管

フラットパネルイメージセンサーに
よる抜群の画像品質

最高度の倍率

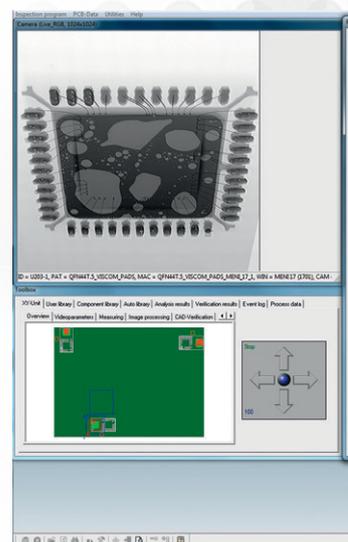
大型で高重量のテストサンプ
ル直径722 mm迄可能

直感的操作や広範な分析機能を具備

簡素化された分類やプロセスコントロールを実
現する無類の**Quality Uplink**

オンサイトサポート、ホットライン、およびリモートメ
ンテナンスで世界的サービス網を充実

Viscomの平面式および回転式ソフトウェア**XVR-CT**



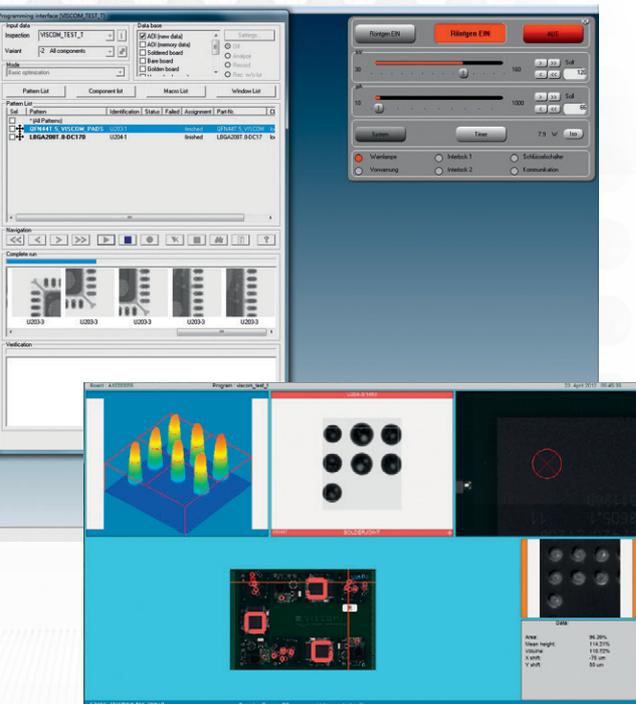
SMD実装における隠れた部分のハンダ接合部位や、パワーエレクトロニクス、特殊パーツの非破壊検査等 — X線検査システムX8068は最高度のフレキシビリティを具現します。応用領域として、個別パーツの無作為抽出検査や特殊検査の他、自動式の始動サポートや量産検査を包括しています。回路基板の様な大型テストサンプルであってもスピーディ且つ確実に検査します。このシステムは品質制御において抜群の画像品質や自動式分析ルーチン、快適なハンドリングを実現するため、高い信頼を得ています。

抜群の画像品質、非常に簡素化された ハンドリング、包括的な分析

X8068 を採用すると、直径722 mm迄の多様なテストサンプルを確実に検査できます。開放型X線管は最高度の解像度および細部認識を抜群の画像品質で具現します。このため、微小欠陥構成も確実に検出します。このシステムが信頼される理由は、全てのハードウェアとソフトウェア双方性能がフルに発揮される高度なテクノロジーが採用されているからです。視野角に依存しないユーザーに便利なIPSモニターがX線検査結果を最高品質で表示します。出来る限り広範囲の検査範囲を得るため、ディテクターは最大60度旋回します。システムのハンドリングは簡単且つ快適です。

X8068独特の強み: 二種類の検査コンセプトViscom XMCとViscom SIを一つの検査システムに統合。特殊検査あるいは特殊パーツの検査にはViscom-XMCソフトウェアが使用可能です。直感的操作や広範な自動分析機能により、テストサンプルはスピーディ且つ正確に制御されます。更に、Viscom固有のXVRコンピュータ断層撮影(CT)による3D復元も可能です。そのため、欠陥箇所の特精度が高まるだけでなく、各層や断面の可視化も可能になります。

全自動X線検査には、Viscom X7056製品群の実証済みSIソフトウェアが使用されます。コンポーネント検査における30年以上の経験に加えて、特にSMD生産に適合した技術が組み合わされています。そのため、無類のViscom Quality Uplinkも使用できます。このユーティリティは、SPI、AOI、AXI、MXI等の検査結果をリンクし、簡素化された分類や、効率的なプロセスコントロールを実現します。例えば、X8068検証ステーションにおけるViscom-3Dハンダペースト検査の検査データ全てを表示できます。欠陥原因は容易に突き止められ、プロセス最適化が簡素化されます。



X8068

X線技術

X線管	開放型マイクロフォーカス透過管Viscom XT9160 T-ED (その他のX線管はお問い合わせ次第)
高電圧	20~160 kV
X線管電流	5~1000 μ A
ターゲット出力	Max. 40 W
幾何学的倍率	> 2500倍
実証済み解像度 (90 kV/80 μ Aにて)	< 4 μ m
イメージコンバータ、対角線方向	7.3"または11.0" FPD、14 Bit
X線キャビネット	StrISchG(放射防護法規)およびStrISchV(放射防護規定)の完全防護機器要求に対応した設計、グローバル規模の使用に向け、CEマークおよびその他の国際基準に準拠。放射能漏れ率 < 1 μ Sv/h

ソフトウェア

ユーザーインタフェース 使用可能なソフトウェア	Viscom XMC / Viscom SI オプション BGA分析ソフトウェア QFN分析ソフトウェア THT分析ソフトウェア ACA分析ソフトウェア(平面分析) 全自動 Viscom-SI分析ソフトウェア XVR-CTソフトウェア(平面式、回転式) 検証ステーションViscom HARAN Viscom Quality Uplink, Viscom AOI, AXIおよびSPIにリンクして プロセスを最適化
----------------------------	--

解析コンピュータ

オペレーションシステム モニター	Windows® SMTおよびエレクトロニクス (DICOM基準) 領域の グレースケール特殊描写用の高解像24"-LCDディスプレイ
---------------------	---

テストサンプルのハンドリング

マニピュレータ	5 軸、サンプルテーブル付
水平X/Y軸	レンジ: 720 mm x 1000 mm
垂直Z軸	レンジ: 320 mm
検査軸:	0°~60° 回転可能
回転軸	n x 360°
テストサンプルの寸法	最大722 mm (直径)
テストサンプルの重量	最大15 kg
テストサンプルの交換	モータ駆動型のウィンドウ開放
その他の軸のオプションあり	提供

その他のシステムデータ

電源	230 V(その他電圧、ご要望に応じた電圧)、1P/N/PE、16 A
システム寸法	1859 mm x 2202 mm x 2155 mm (幅 x 高さ x 奥行き)
重量	< 3200 kg

